## 01;05.4

# Электронный спектр Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> в прифермиевской области по данным численных расчетов и ультрафиолетовой (8.43) фотоэлектронной спектроскопии

### © А.М. Апрелев, А.А. Лисаченко

# С.-Петербургский государственный университет Научно-исследовательский институт физики

### Поступило в Редакцию 26 июня 1997 г.

Структуру спектра парциальной плотности заполненных состояний  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$  в области  $E_b < 4 \, eV$ , полученную методом ультрафиолетовой ( $hv = 8.43 \, eV$ ) фотоэлектронной спектроскопии, сравнивали с рассчитанной методом сильной связи. Результаты расчетов согласуются с экспериментальными результатами в области энергий связи  $1 < E_b < 4 \, eV$ . На основании анализа эволюции спектров при термо- и фотообработках в сверхвысоком вакууме и в кислороде сделан вывод, что наибольшей подвижностью в решетке обладают атомы кислорода из Си–О плоскостей, а поверхность монокристалла образована плоскостью Bi–O.

Свойства нормального и сверхпроводящего состояний ВТСП-купратов связывают с особенностями их электронной структуры и, в частности, с энергетическим спектром заполненных состояний в прифермиевской области [1].

Ранее в работе [2] методом ультрафиолетовой ( $hv = 8.43 \,\mathrm{eV}$ ) фотоэлектронной спектроскопии обнаружена и исследована структура спектра заполненных состояний  $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Sr}_2\mathrm{CaCu}_2\mathrm{O}_8$  в прифермиевской области  $E_b < 4 \,\mathrm{eV}$ . Анализ эволюции спектра в ходе термо- и фотоактивированных обработок в вакууме и в кислороде in situ показал, что интенсивность ряда пиков этой структуры коррелирует с концентрацией кислорода в образце. Это позволило предположить их генетическую связь с гибридизованными кислородными орбиталями. Разность фотоэлектронных спектров, снятых при различном содержании кислорода в образце, можно связать с парциальной плотностью одночастичных состояний.

#### 69



**Рис. 1.** Зависимость размера *k*-области, зондируемой в эксперименте фотоэлектронной спектроскопии (hv = 8.43 eV), от величины кинетической энергии эмитируемых электронов.

Важным аргументом в пользу сделанных предположений было бы совпадение разности экспериментальных спектров, снятых при различном содержании кислорода, с рассчитанным спектром парциальной кислородной плотности заполненных состояний. С другой стороны, такое совпадение свидетельствовало бы об адекватности модели и приближений, используемых при расчете. Однако непосредственное сопоставление экспериментальных результатов [2] с результатами расчетов, приведенных в литературе (см., например, [3]), невозможно, поскольку в наших экспериментах зондируется лишь часть зоны Бриллюена.

Целью настоящей работы было проведение расчетов парциальной плотности заполненных кислородных состояний с интегрированием по зондируемой в эксперименте части зоны Бриллюена и сопоставление результатов расчета и эксперимента.



**Рис. 2.** Расчетные спектры парциальной кислородной плотности электронных состояний и экспериментальный разностный фотоэлектронный спектр: *1–3* — рассчитанные парциальные плотности электронных состояний, соответствующие кислороду из плоскостей Sr–O, Bi–O, Cu–O соответственно; *4* — разностный спектр, соответствующий нагреву от 77 до 300 K в сверхвысоком вакууме.

Результаты расчетов и эксперимента. При сравнении экспериментальных спектров с расчетными необходимо учитывать особенности проводимых экспериментов. Так, в наших опытах [2] для возбуждения фотоэмиссии используется необычно мягкое излучение с энергией квантов hv = 8.43 eV. Регистрировали фотоэлектроны, эмитированные в конусе с углом при вершине  $34^{\circ}$  и осью, нормальной к поверхности. Поскольку энергия возбужденного электрона сравнима с величиной работы выхода, электронный пучок испытывает сильное преломление на поверхностном барьере. Это значительно сужает зондируемую область в *k*пространстве. Кроме того, применение схемы иммерсионного объектива с постоянным вытягивающим потенциалом [2] приводит к зависимости размеров зондируемой области от величины энергии связи электронов в начальном состоянии. Граница области в пространстве ( $E_b$ ,  $k_x$ ,  $k_y$ ) по данным проведенных расчетов [4] является поверхностью вращения с

осью, направленной нормально к поверхности (рис. 1). По оси абсцисс отложены значения квазиимпульса в процентах от размера зоны Бриллюена  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$  в направлении  $\Gamma$ –М. Как видно из рисунка, в наших фотоэмиссионных экспериментах зондируются состояния в области *k*-пространства с размерами, значительно меньшими зоны Бриллюена (около 10%). Поэтому сопоставление экспериментальных спектров с приведенными в литературе спектрами интегральных по *k*-плотности состояний было бы некорректным. В связи с этим проведены расчеты плотности заполненных состояний с учетом специфики проведенных в [2] экспериментов. Расчеты выполнены С.С. Назиным (Институт физики твердого тела РАН) полуэмпирическим методом сильной связи [5], хорошо зарекомендовавшим себя при расчетах электронной структуры  $Bi_2Sr_2CuO_6$ , La<sub>1.85</sub>Sr<sub>0.15</sub>CuO<sub>4</sub>, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>, Ti<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>CuO<sub>6</sub> [6,7].

Расчеты проведены для объемоцентрированной кубической решетки тетрагональной фазы соединений Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (a = b = 5.398, c = 30.52). В число базисных орбиталей включены  $6s^2$ ,  $6p^3$ ,  $5d^{10}$ орбитали Bi;  $5s^2$ , 5d орбитали Sr;  $4s^2$ , 4s,  $3d^{10}$  орбитали Cu; 2s, 2pорбитали кислорода и 4d орбитали Ca. Подробное описание методики расчета приведено в [6,7]. Результаты расчетов парциальной плотности состояний, связанных с кислородом и дающих заметный вклад в диапазоне энергий связи  $0 \div 6 \text{ eV}$ , приведены на рис. 2 (кривые 1-3). Состояния, полученные при гибридизации кислородных орбиталей с орбиталями стронция, висмута, меди, расположены в плоскостях O–Sr, O–Bi, O–Cu соответственно. Каждая из кривых (рис. 2, кривые 1, 2, 3) обладает характерными особенностями: парциальная плотность состояний O(Cu) имеет два пика при  $E_b = 1.8$  и 2.8 eV, O(Bi) имеет пик при 1.4 eV; плотность состояний O(Sr) максимальна при  $E_b = 2.3 \text{ eV}$ .

Парциальные плотности заполненных электронных состояний сравнивали с экспериментальными разностными спектрами, полученными при различных обработках в сверхвысоком вакууме и в кислороде. Разностные спектры получали вычитанием из фотоэлектронного спектра образца, подвергнутого какой-либо обработке, спектра образца в состоянии до этой обработки. Положение пиков рассчитанной плотности состояний, образованных кислородом из O–Cu плоскостей, совпадает (в диапазоне энергий связи  $1 < E_b < 4 \text{ eV}$ ) с разностными спектрами, соответствующими как нагреву от 77 до 300 К сколотого в сверхвысоком вакууме монокристалла  $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$  (рис. 2, кривая 4), так и последующим его термообработкам в сверхвысоком вакууме и



**Рис. 3.** Экспериментальные разностные фотоэлектронные спектры: I-3 — разностные спектры, соответствующие нагреву в сверхвысоком вакууме до 570 К — I, в кислороде (0.5 Torr) до 570 и 670 К — 2, 3; 4, 5 — разностные спектры, соответствующие засветке полным светом ртутной лампы ДРТ-120 (0.05 W/cm<sup>2</sup>) в сверхвысоком вакууме и в кислороде (0.5 Torr) 30 min соответственно.

в кислороде при 570 и 670 К (рис. 3, кривые I-3). При этом в экспериментальном спектре не проявляется особенность при  $E_b = 1.5 \text{ eV}$ , обусловленная кислородом Bi–O плоскостей. Кроме того, возможный вклад в экспериментальный спектр орбиталей кислорода из Sr–O плоскостей также невелик, поскольку пик 2.3 eV в спектре лишь незначительно превышает пик при 1.8 eV.

Полученный результат позволяет сделать вывод о возможности адекватного описания электронной структуры в диапазоне энергий связи  $1 < E_b < 4 \,\mathrm{eV}$  в рамках одноэлектронного приближения. Следует отметить, что в отличие от рассчитанной парциальной (кислородной) плотности заполненных электронных состояний в диапазоне  $0 < E_b < 1 \,\mathrm{eV}$  экспериментальный фотоэлектронный спектр имеет заметные особенности при 0.18 и 0.9 eV. Это, возможно, связано с недостаточностью модели, не рассматривающей корреляции носителей и неоднородность распределения кислорода, которая возникает из-за взаи-

модействия кислородных вакансий при заметной диффузии кислорода в решетке [8,9].

Из сравнения интенсивности пиков разностных экспериментальных (рис. 1, кривая 4 и рис. 2, кривые I-3) и рассчитанных спектров заполненных состояний (рис. 1, кривые I-3) следует, что наибольшей подвижностью в решетке Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> обладает кислород из Cu–O плоскости, а при термоактивированном обеднении кислородом приповерхностного слоя новые вакансии располагаются в слоях Cu–O.

В отличие от термообработок, фотоактивация приводит к проявлению в спектре особенности при  $E_b = 1.5 \text{ eV}$  (рис. 2, кривая 4, 5). Такой экспериментальный факт можно объяснить увеличением относительного вклада кислорода Bi–O плоскости при фотоактивации кислородного обмена образца с газовой фазой. Это может происходить при фотоактивированной десорбции (адсорбции) кислорода, учитывая, что у сколотых монокристаллов Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> граница с вакуумом образуется плоскостью Bi–O.

Авторы благодарны С.С. Назину за проведение расчетов, профессору В.А. Гражулису и А.М. Ионову за плодотворные дискуссии.

Данная работа выполнена в рамках Федеральной программы "Поверхностные атомные структуры" (проект 95–1.14) и Программы Госкомвуза исследований в области фундаментального естествознания (проект N 95–07 100–164).

# Список литературы

- [1] Shen Z.-X., Dessau D.S. // Phys. Rep. 1995. V. 253. N 1-3. P. 3-162.
- [2] Aprelev A.M., Grazhulis B.A., Ionov A.M., Lisachenko A.A. // Physica C. 1994.
  V. 235–240. P. 1015–1016.
- [3] Kurmaev E.Z., Finkelstein L.D. // Int. J. Mod. Phys. B. 1991. V. 5. N 8. P. 1097.
- [4] Апрелев А.М. // Канд. дис. СПбГУ. 1997 г.
- [5] Харрисон У. Электронная структура и свойства твердых тел. М.: Мир, 1983.
- [6] Meshkov S.V., Molotkov S.N., Nazin S.S., Smirnova I.S., Tatarskii V.V. // Physica C. 1989. V. 161. P. 497–502.
- [7] Meshkov S.V., Molotkov S.N., Nazin S.S., Smirnova I.S., Tatarskii V.V. // Physica C. 1990. V. 172. P. 149–154.
- [8] Sarma D.D., Barman S.R., Kajueter H., Kotliar G. cond-mat/9609259.
- [9] Fujimori A., Hase I., Nakamura M. et al. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. P. 9841.